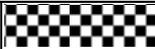
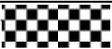
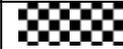


測 試 報 告

測試報告編號：T-NM-002-110-001

顧客基本資料			
單位名稱	台灣半導體研究中心	委託者	
聯絡電話	03-5773693# 	E-mail	 @narlabs.org.tw
地址	新竹市東區展業一路 26 號		

測試基本資料		
訂單編號：S-110-TAF-004	測試名稱：階高量測	測試件數量：1
測試儀器型號：NM-002, Veeco D5000	量測地點：R221	
委託日期：2021/08/24	分析日期：2021/08/25	完成日期：2021/08/25
測試件編號與描述： 量測表面結構之階高。		
測試方法： 依據 N3-TM01 大試片原子力顯微鏡作業標準 1.0 版本執行。		
測試規格： Reference standard: VLSI 6429-004-049 Scan mode: Tapping mode Tip: NANOSENSORS PPP-RT-NCHR Scan size: 5um Environmental conditions Scan rate: 0.5Hz Temperature: 25.3°C, Humidity:51.7%		
測試結果：		
編 號	S-110-TAF-004-a	
顧客測試件編號	F1	
線距量測值 (nm)	424	

測試工程師	報告簽署人	技術主管
品質主管	實驗室主管	實驗室印章

附註： 1. 未得到本實驗室書面同意，本報告不得摘錄複製，但全部複製除外。
2. 本報告所用測試件係由委方提供，本實驗室僅對測試件之試驗結果負責。
3. 本報告需加蓋本實驗室印章及簽名始生效。
4. 本報告所記載之事項僅作參考，不得用於商業廣告或法律訴訟之證據等其他用途。

